

05; 06

© 1991 г.

**ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ТРАНСПАРАНТОВ**

B. B. Беляев, B. Г. Чигринов, Н. Ф. Ковтонюк, А. Б. Кузнецов

Получено выражение для показателя эффективности жидкокристаллических материалов для оптически управляемых транспарантов, учитывающее зависимость деформации ЖК от напряжения смещения. Физический смысл показателя эффективности — это регистрируемая фотоприемником энергия считывающего излучения при импульсной записи входного изображения. Зависимость показателя от напряжения смещения имеет максимум, который характеризует динамическую чувствительность НЖК к внешнему воздействию. Даны оценка эффективности различных ЖК веществ и смесей для применения в оптически управляемых транспарантах.

Оптически управляемые транспаранты (ОУТ), или пространственно-временные модуляторы света, являются основными элементами систем оптической обработки изображений [1-5]. Среди них жидкокристаллические ОУТ выделяются модуляционными характеристиками, низкими управляющими напряжениями, широким диапазоном рабочих температур, многочисленными функциональными возможностями. В настоящее время в ОУТ применяются обычные материалы для твист-эффекта. Направленная разработка жидкокристаллических материалов для ОУТ с целью повышения контраста выходного изображения или интенсивности пространственного спектра анализируемого изображения не проводилась. При этом следует сказать, что электрооптика твист-эффекта, имея некоторые общие свойства с электрооптикой используемого в ОУТ S-эффекта, все же существенно отличается от него [6]. Развитию разработок ЖКМ для ОУТ препятствовало отсутствие четких критерии, характеризующих их способность формировать изображение при заданном режиме управления. В [7] предложено использовать для оценки того или иного ЖКМ для ОУТ число

$$M = K_{11}(\Delta n)^2/\gamma_1, \quad (1)$$

характеризующее скорость изменения на 1π фазовой задержки $\Delta\Phi$ света, проходящего через планарно ориентированный слой ЖКМ (K_{11} — коэффициент упругости, $n=n_e-n_0$ — двулучепреломление, γ_1 — вращательная вязкость).

Имея очень удобный вид, коэффициент M не совсем точно описывает реальное изменение фазовой задержки при изменении режима управления ОУТ. Для оценки качества изображения на выходе ОУТ важна не величина фазовой задержки $\Delta\Phi$ между необыкновенным и обыкновенным лучами, которая используется при выводе выражения для M , а разность фаз $\delta\Phi$ между необыкновенными лучами в разных точках слоя ЖК, возникающая вследствие неоднородной по апертуре освещенности фоточувствительной части ОУТ на входе.

Целью настоящей работы является оценка эффективности различных жидкокристаллических веществ и их смесей для ОУТ, а также уточнение вида показателя эффективности с учетом деформации слоя ЖК.

Согласно [7], формула для показателя M выводится при подстановке в выражение для времени переориентации директора

$$\tau = \gamma_1 L^2 / \pi^2 K_{11} \quad (2)$$

значения толщины слоя ЖК L , получающегося из условия

$$\Delta\Phi = 2\pi L \Delta n / \lambda = \pi, \quad (3)$$

где λ — длина волны считающего света.

Следует отметить, что (2) соответствует малой деформации директора, а (3) — полной переориентации директора и вывод показателя M таким способом является методически неверным. При работе ОУТ максимальная величина контраста в выходном изображении или интенсивности пространственного спектра получается при разности фаз $\delta\Phi$ в местах, соответствующих большей и меньшей засветке фотопроводника, равной 1π (величины $\Delta\Phi$ и $\delta\Phi$ отличаются на множитель, показывающий, какая часть напряжения питания ОУТ приходится на слой ЖК [8]). Поэтому качество изображения или его пространственного спектра на выходе ОУТ зависит не от полной величины фазовой задержки или времени свободной релаксации директора, определяемых выражениями (2) и (3), а от времени τ_π и напряжения ΔU_π , при которых происходит изменение фазовой задержки на 1π . Рассмотрим, как изменяются величины τ_π и ΔU_π при $U_{ЖК} \geq U_n$ и при произвольной величине напряжения смещения $U_{ЖК}$.

В первом случае зависимость фазовой задержки от напряжения смещения описывается полученным в [9] соотношением

$$\delta = (\Delta\Phi_{\max} - \Delta\Phi(U_{ЖК})) = \frac{2\pi L}{\lambda} \frac{n_s(n_s^2 - n_0^2)}{n_0^2} \left(\frac{K_{33}}{K_{11}} + \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon_\perp} \right)^{-1} \frac{U_{ЖК} - U_n}{U_n}, \quad (4)$$

откуда из условия $\delta = \pi$ получаем

$$\frac{\Delta U_\pi}{U_n} = \frac{\lambda}{2L} \frac{n_0^2}{\Delta n \cdot n_s(n_s + n_0)} \left(\frac{K_{33}}{K_{11}} + \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon_\perp} \right) \quad (5)$$

(K_{33} — коэффициент упругости для деформации продольного изгиба; n_s , n_0 — показатели преломления, $\Delta\epsilon/\epsilon_\perp$ — относительная величина диэлектрической анизотропии).

Из [7] следует, что высокая крутизна вольт-контрастной характеристики (ВКХ) S-эффекта (минимальные значения ΔU_π) получается для твист-эффекта при малых величинах отношений K_{33}/K_{11} и $\Delta\epsilon/\epsilon_\perp$ (вклад этих величин в крутизу ВКХ твист-эффекта различен [8]), а также в противоположность твист-эффекту при больших значениях двупреломления Δn . Из соотношения (5) можно оценить, что увеличение Δn на 1 % при $\Delta n=0.2$, $n_0=1.5$ приводит к уменьшению $\Delta U_\pi/U_n$ на 1.2 %, уменьшение K_{33}/K_{11} или $\Delta\epsilon/\epsilon_\perp$ на 1 % уменьшает значение $\Delta U_\pi/U_n$ на 0.5 % при $K_{33}/K_{11}=\Delta\epsilon/\epsilon_\perp=1$ или на 0.8 % при реально достижимых величинах $K_{33}/K_{11}=0.8$ и $\Delta\epsilon/\epsilon_\perp=0.4$. При больших напряжениях смещения $U_{ЖК}$, когда зависимость $\Delta\Phi(U_{ЖК})$ становится нелинейной, величина ΔU_π может быть рассчитана при использовании результатов [11, 12].

Зависимость времени переключения от $U_{ЖК}$ теоретически и экспериментально рассмотрена в [13]. Значения $\tau_\pi^{вкл}$, $\tau_\pi^{выкл}$ получаются при приложении к слою ЖК стационарного напряжения смещения $U_{ЖК}$ и включении или выключении добавки напряжения, равной ΔU_π . При $U_{ЖК} \geq U_n$, $\tau_\pi^{вкл}$, $\tau_\pi^{выкл}$ можно описать эмпирическими формулами

$$\tau_\pi^{вкл} = \frac{a \cdot \eta(\theta) \cdot L^2}{\Delta\epsilon \cdot (U_{ЖК} + \Delta U_\pi)^2 / 4\pi^3 - K(\theta)}, \quad (6)$$

$$\tau_\pi^{выкл} = \frac{a \cdot \eta(\theta) \cdot L^2}{\Delta\epsilon \cdot U_{ЖК}^2 / 4\pi^3 - K(\theta)}, \quad (7)$$

где a — определяемая формой электрооптического отклика константа, $\eta(\theta)$ и $K(\theta)$ — зависящие от величины угла наклона θ директора в ячейке эффективные значения коэффициентов упругости и вязкости.

Без учета градиентного члена $(d\theta/dz)^2$, где Z — координата, перпендикулярная плоскости ячейки, для $K(\theta)$ с хорошей точностью можно записать

$$K(\theta) = K_{11} \cos^2 \theta + K_{33} \sin^2 \theta. \quad (8)$$

Эффективную вязкость $\eta(\theta)$ можно определить из следующих соотношений:

$$\eta(\theta) = \gamma_1 - \varphi^2 / \Psi, \quad (9)$$

$$\varphi = \alpha_3 \cos^2 \theta - \alpha_2 \sin^2 \theta, \quad (10)$$

$$\Psi = \alpha_1 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} (\alpha_3 + \alpha_6) \cos^2 \theta + \frac{1}{2} (\alpha_5 - \alpha_2) \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \alpha_4, \quad (11)$$

α_i , $i=1-6$ — коэффициенты вязкости Лесли.

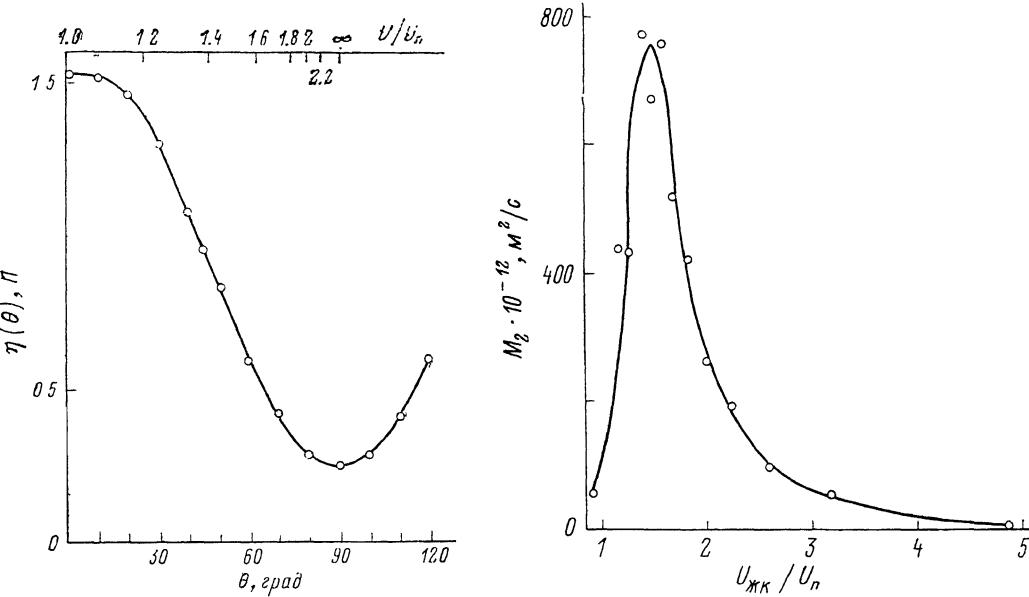


Рис. 1. Зависимость эффективного значения вращательной вязкости НЖК $\eta(\theta)$ от угла наклона директора θ .

При $\theta=0$ $\eta(\theta)=\eta_s \approx \gamma_1$; $\theta=90^\circ$ $\eta(\theta)=\eta_B$. На верхней оси отложены приведенные к пороговому значению напряжения смещения, при которых угол переориентации директора в центре слоя ЖК равен θ . Значения η при $\theta > 90^\circ$ приведены для оценки влияния обратного течения.

Рис. 2. Зависимость показателя эффективности M_2 от приведенного к пороговому ($U_\pi = 4.4$ В) напряжения смещения.

МББА + 3 % 4-цианфенилового эфира 4'-гептилбензойной кислоты. $L=23$ мкм, $\lambda=0.633$ мкм.

Учитывая неоднородное распределение угла наклона $\theta(Z)$ внутри ячейки и возникающее при этом обратное течение, в [13] для описания динамики частичной переориентации ЖК получен интегральный член вида

$$R = \int_0^L \frac{\varphi}{\Psi} \frac{\partial \theta}{\partial t} dz \sqrt{\int_0^L \frac{dz}{\Psi}}, \quad (12)$$

учет которого уменьшает эффективное значение вязкости в 1—1.4 раз в зависимости от U_{JKK} . Величина $\eta(\theta)$ меняется в диапазоне от $\eta_s = \gamma_1 - (\alpha_3^2 / \eta_1)$ при $\theta=0$ до $\eta_B = \gamma_1 - (\alpha_2^2 / \eta_2)$ при $\theta=\pi/2$ (γ_1 , γ_2 — коэффициенты вязкости Мезовича). На рис. 1 приведена зависимость эффективной вязкости от угла деформации директора, полученная при подстановке в (9)–(11) коэффициентов α , для МББА [14]. Для НЖК выполняются соотношения $\eta_s \approx \gamma_1$ и $\eta_s / \eta_B \equiv \eta_1 / \eta_2$ [15]. В [16] описана взаимосвязь вращательной вязкости и динамической вязкости η , измеряемой при течении НЖК и близкой по величине K_{11} . С учетом взаимосвязи величин γ_1 и γ_B , K_{11} и K_{33} для описания динамики переориентации НЖК достаточно вязкоупругого отношения γ_1 / K_{11} .

Поскольку время переключения НЖК обратно пропорционально квадрату напряжения смещения, то эффективность ЖКМ стоит оценивать параметром, включающим в себя произведение $\tau_\pi (\Delta U_\pi)^2$. Согласно (5), $\Delta U_\pi \sim U_n$, поэтому наиболее простое выражение, описывающее эффективность ЖКМ для ОУТ, выглядит следующим образом:

$$M_1 = \frac{1}{\tau_\pi^{\text{выкл}}} \left(\frac{U_\pi}{\Delta U_\pi} \right)^2. \quad (13)$$

Показатель M_1 имеет размерность s^{-1} . Одинаковую с M размерность ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) имеет параметр, который, как будет показано ниже, не зависит от толщины ЖК ячейки и длины волны считающего света

$$M_2 = \frac{\lambda L}{\tau_\pi^{\text{выкл}}} \left(\frac{U_\pi}{\Delta U_\pi} \right)^2. \quad (14)$$

На рис. 2 приведена зависимость от напряжения смещения $U_{\text{ЖК}}$ параметра M_2 для смеси 97 % МББА и 3 % 4-цианфенилового эфира 4-гентилбензойной кислоты, полученная при измерении ВКХ S-эффекта и времени изменения фазовой задержки слоя ЖК на 1π ($\lambda=0.633 \text{ мкм}$). Изменение $M_2 (U_{\text{ЖК}})$ обусловлено быстрым спаданием $\tau_\pi^{\text{выкл}}$ с ростом $U_{\text{ЖК}}$ при приблизительно постоянной величине ΔU_π , когда $U_{\text{ЖК}} \gg U_n$, и значительным увеличением ΔU_π при большой деформации слоя НЖК. Оптимальным по сочетанию быстродействия и малому изменению переориентации директора является $U_{\text{ЖК}}=1.5-2 U_n$.

Следует отметить схожесть вида зависимости от напряжения для показателя M_2 и для интенсивности пространственного спектра дифракционной решетки [17].

Рассмотрим подробнее случай $U_{\text{ЖК}} \gg U_n$. Пусть $U_{\text{ЖК}} = U_n + \Delta U_\pi$. Тогда $\eta(\theta) = \eta_s \approx \gamma_1$ и $K(b) = K_{11} = U_n^2 \Delta \varepsilon / 4\pi^3$ [6, 9]. Используя (7), преобразуем выражение (14) следующим образом:

$$M_2 = \frac{\Delta \varepsilon (U_n + \Delta U_\pi)^2 / 4\pi^3 - K_{11}}{a \cdot \eta_s} \frac{\lambda L}{L^2} \left(\frac{U_\pi}{\Delta U_\pi} \right)^2 = \frac{\Delta \varepsilon \cdot U_n^2}{4\pi^3} \frac{2\Delta U_\pi}{a \cdot \eta_s} \frac{U_\pi}{(\Delta U_\pi)^2} \frac{\lambda}{L} = \frac{K_{11}}{\gamma_1} \frac{2\lambda}{aL} \frac{U_n}{\Delta U_\pi}. \quad (15)$$

Из (15), используя (5) и очевидное соотношение $n_e = n_0 + \Delta n$, получаем

$$\begin{aligned} M_2 &= \frac{K_{11}}{\gamma_1} \frac{4}{a} \frac{\Delta n (n_e + n_0) n_e}{n_0^3} \left(\frac{K_{33}}{K_{11}} + \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon_\perp} \right)^{-1} = \\ &= \frac{8}{a} \frac{K_{11}}{\gamma_1} \frac{\Delta n \cdot n_0^2 + 1.5 (\Delta n)^2 \cdot n_0 + 0.5 (\Delta n)^3}{n_0^2} \left(\frac{K_{33}}{K_{11}} + \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon_\perp} \right)^{-1}. \end{aligned} \quad (16)$$

Опуская в (16) постоянный сомножитель и в третьем сомножителе члены $c (\Delta n)^2$, $(\Delta n)^3$ (при $\Delta n=0.2$ и $n_0=1.5$ ошибка составляет около 20 %), получаем простое выражение для показателя эффективности ЖКМ для ОУТ, включающее только физические параметры НЖК,

$$M_3 = \frac{K_{11} \Delta n}{\gamma_1} \left(\frac{K_{33}}{K_{11}} + \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon_\perp} \right)^{-1}. \quad (17)$$

Показатель M_3 отличается от предложенного в [7] показателя M показателем степени при Δn и наличием суммы отношений коэффициентов упругости и диэлектрических проницаемостей. Показатель M_3 точнее описывает изменение фазовой задержки считающего света при изменении режима управления ОУТ, чем показатель M . При этом температурные зависимости обоих показателей похожи (рис. 3, 4), хотя максимум $M_3 (T)$ смешен относительно максимума $M (T)$ ближе к температуре просветления.

В таблице приведены величины показателей M и M_3 различных полярных (смеси 40 и 60 мол % пятого и седьмого гомологов цианпроизводных) и слабополярных соединений, полученные по данным, приведенным в [18-20]. Наибольшее значение показателя эффективности среди полярных соединений имеют производные алкилцианобифенилов ($M=2.33 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$, $M_3=3.82 \times 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$), среди неполярных — производные алкилалкокситоланов ($M=5.94 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$, $M_3=12.6 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$). Следует также отметить высокое

значение M_3 для производных пиридина и фенилциклогексана и азоксисоединений. Весьма привлекательными являются также алкенильные производные фенилциклогексана с полярной NCS-группой [21].

Показатели эффективности M и M_3 ЖК веществ при $t = 25^\circ\text{C}$

Структурная формула	γ_1 , Па · с	$K_{11} \cdot 10^{-12}$, Н	$\frac{K_{33}}{K_{11}}$	$\frac{\Delta \epsilon}{\epsilon_\perp}$	Δn	T_{NI} , $^\circ\text{C}$	$M \cdot 10^{-12}$, $\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$	$M_3 \cdot 10^{-12}$, $\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.11	7.65	1.38	1.95	0.183	39	2.33	3.82
<chem>CnH2n+1-O-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.33	10.4	1.40	1.65	0.19	72	1.14	1.96
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.1	11.5	1.78	1.8	0.11	56.4	1.39	3.53
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccccc1-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.36	11.2	2.10	1.75	0.13	96.5	0.53	1.05
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1cncnc1-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.19	10.2	1.10	2.95	0.18	51.2	1.74	2.39
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1cncnc1-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.184	7.50	1.28	1.55	0.178	44.2	1.29	2.56
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2cncnc2C#N</chem>	0.220	8.25	1.40	1.08	0.18	49.2	1.22	2.72
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2cncnc2C#N</chem>	0.178	7.46	1.75	1.35	0.105	58	0.46	1.42
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2cncnc2C#N</chem>	0.350	14.00	1.50	0.95	0.190	62.7	1.44	3.10
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2cncnc2C#N</chem>	0.140	8.80	1.57	0.47	0.13	57.3	1.06	4.01
<chem>CH2=CH-C2H4-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N</chem>	0.051	9.5	—	—	0.183	41.1	6.24	—
<chem>C4H9-C(=O)c1ccc(cc1)-c2cncnc2C(=O)OC</chem>	0.158	9.74	1.66	-0.06	0.28	74.7	4.83	10.79
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)OC(=O)C2H5</chem>	0.220	9.7	1.1	0.5	0.14	51.6	0.86	3.86
<chem>CnH2n+1-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)OC(=O)C2H5</chem>	0.134	12.7	1.3	0.2	0.10	73.6	0.95	6.32
<chem>C5H11-C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)OC</chem>	0.140	11.40	1.74	0.00	0.27	57.3	5.94	12.64

Рассмотрим также, как изменяются величины показателей M и M_3 от концентрации 4-пентил-(4'-пианфенилциклогексана) (ФЦГ-7) в смесях с ЖК-440 (смесь А в работе [22]). При вычислении M и M_3 использованы данные, приведенные в [20, 23, 24]. Показатель M_3 равен $10 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$ в диапазоне концентраций полярного соединения 0–30 вес. %, а затем линейно уменьшается с концентрацией ФЦГ-7 до $1.25 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$. Оптимальной концентрацией полярного соединения в этой системе смесей является концентрация 20 вес. %, при которой минимально значение ΔU_π . Показатель M почти монотонно уменьшается с ростом $X_{\text{ФЦГ}}$. Видно, что показатель M_3 лучше подходит для описания характеристик ЖКМ для ОУТ.

Концентрационные зависимости показателей M и M_3 определяются уменьшением Δn и увеличением $\Delta \epsilon / \epsilon_\perp$ с ростом концентрации полярного компонента, а также существенно немонотонным изменением K_{11} , γ_1 и K_{33}/K_{11} .

Таким образом, в настоящей работе получено выражение для показателя эффективности ЖКМ для оптически управляемых транспарантов (пространственно-временных модуляторов света), основанное на изменении фазовой задержки проходящего через слой ЖК света при изменении режима и не зависящее от толщины слоя ЖК и длины волны считывающего света. Рассмотрены связь показателя эффективности с молекулярным строением ЖК веществ и концентрационная зависимость показателя в смесях веществ различной полярности. Показано, что наилучшими компонентами ЖКМ для ОУТ являются производные цианбифенилов, фенилциклогексана и алкил-алкокситоланов.

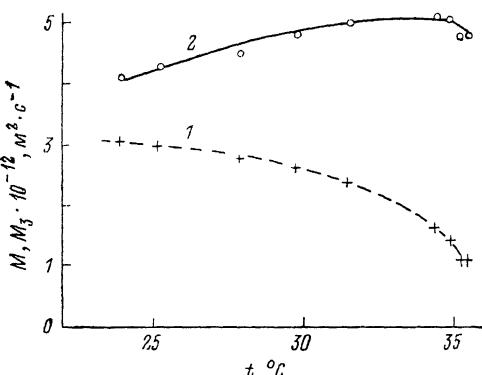


Рис. 3. Температурная зависимость показателей эффективности M (1) и M_3 (2) 4-пентил-4'-цианбифенила.

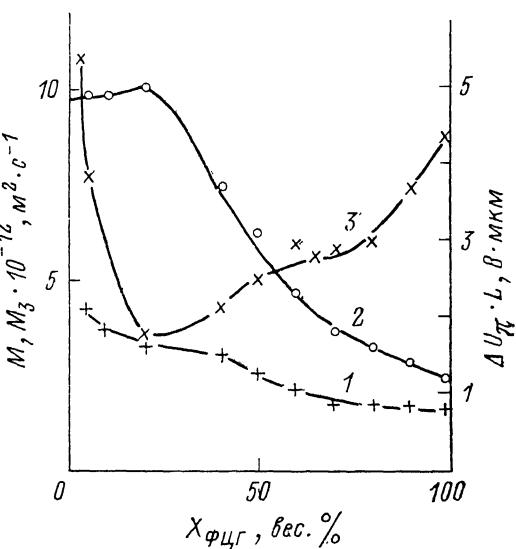


Рис. 4. Зависимость от концентрации полярного компонента $X_{\text{ФЦГ}}$ показателей эффективности M (1), M_3 (2) и полуволнового напряжения $\Delta U_{\pi} \cdot L \cdot \mu\text{мкм}$ (3, масштаб справа, $\lambda = 0.633$ мкм) для смесей ФЦГ-7 с ЖК-440.

Список литературы

- [1] Васильев А. А., Касасент Д., Компанец И. Н., Парфенов А. В. Пространственные модуляторы света. М.: Радио и связь, 1987.
- [2] Думаревский Ю. Д., Ковтонюк Н. Ф., Савин А. И. Преобразователи изображений на основе структур полупроводник—диэлектрик. М.: Наука, 1987.
- [3] Сихарулидзе Д. Г., Чилая Г. С. Преобразователи изображений типа МДП—электрооптический материал. М.: Радио и связь, 1986.
- [4] Владимириров Ф. Л., Моричев И. Е., Плетнёва Н. И. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 3. С. 657.
- [5] Мыльников В. С., Грознов М. А., Морозова Е. А. и др. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. Вып. 1. С. 38.
- [6] Чигринов В. Г. // Кристаллография. 1982. Т. 27. С. 404.
- [7] Wu S. T., Lackner A. M., Efron U. // SPIE. 1987. Vol. 824. P. 49.
- [8] Беляев В. В., Девличанская Н. Н., Долгих А. В. и др. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 3. С. 139.
- [9] Чигринов В. Г., Гребенкин М. Ф. // Кристаллография. 1975. Т. 20. С. 1240—1244.
- [10] Neuring J. // Proc. III Liquid Crystal Conf. of Soc. Countries. «Advances in Liquid Crystal Research & Applications». Oxford: Pergamon Press; Budapest: Akademiai Kiado, 1980. Vol. 2. P. 1155.
- [11] Balzarini D. A., Dunmur D. A., Palffy-Muhoray P. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. Lett. 1983. Vol. 102. P. 35.
- [12] Weiford K. R., Sambles J. R. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1987. Vol. 147. P. 25.
- [13] Чигринов В. Г., Беляев В. В. // Кристаллография. 1977. Т. 22. С. 603—606.
- [14] Knepper H., Schneider F., Sharma N. K. // J. Chem. Phys. 1982. Vol. 77. P 3203.
- [15] Van der Meulen J. P., Zijlstra R. J. J. // Physica. 1985. Vol. 132 B. P. 153.
- [16] Bock F.-J., Knepper H., Schneider F. // Liq. Cryst. 1986. Vol. 1. P. 239.
- [17] Антипин С. Н., Беляев В. В., Ковтонюк Н. Ф. и др. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 1. С. 80—83.

- [18] Беляев В. В. // Успехи химии. 1989. Т. 58. № 10. С. 1601—1670.
- [19] Беляев В. В., Гребенкин М. Ф. // Кристаллография. 1983. Т. 28. С. 1003—1006.
- [20] Гребенкин М. Ф., Иващенко А. В. Жидкоクリсталлические материалы. М.: Химия, 1989.
- [21] Buschek R., Schadt M. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1987. Vol. 149. P. 359.
- [22] Барник М. И., Беляев С. В., Гребенкин М. Ф. и др. // Кристаллография. 1978. Т. 23. С. 805.
- [23] Grebenkin M. F., Beresnev G. A., Belyaev V. V. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1983. Vol. 103. P. 1.
- [24] Беляев В. В., Гребенкин М. Ф. // Кристаллография. 1984. Т. 29. С. 815—816.

Поступило в Редакцию
30 августа 1990 г.